

F70

薄膜厚度测量仪



测量厚度上限可达 15 毫米可透光材料

对可透光材料来说，色差共焦测量（CTM）是一种非接触式的测量方式，最多可同时测量两层。这种测量方式，较不受待测样品表面粗糙度、均匀性、或曲率的影响。

CTM 厚度测量基本上是藉由探测膜层上下界面的距离进而获得厚度值。透过专业透镜聚焦不同波长的光，而聚焦在待测样品上下界面的光反射回探测器后，就会在光谱图中看到二处信号波峰，进而推算出波峰之间的距离，即为待测薄膜的厚度值（本法利用不同波段，光颜色差异来探测膜层厚度，故取名色差共焦测量）。

具有 USB 接口与 Windows 相容软件的系统可以再几分钟设定完成，而测量结果在几秒钟即可完成。

相关应用

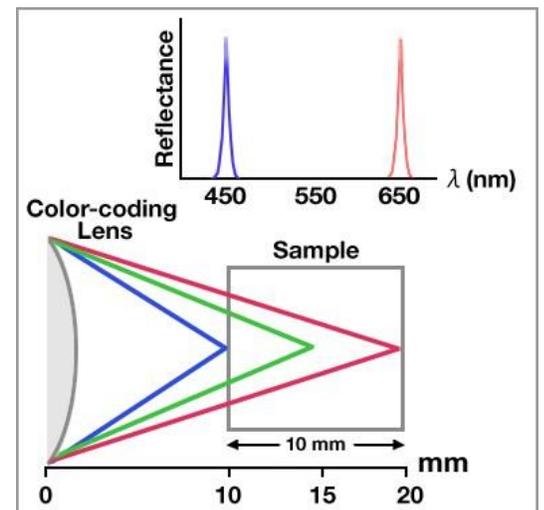
- 任何表面涂层，甚至药片、木材与纸张
- 玻璃与塑胶板材，管材、容器
- 光学镜片

Filmetrics 优势

- 嵌入式在线诊断
- 免费离线分析软件
- 精细的历史数据功能，帮助用户有效的存储，重现与绘制测量结果

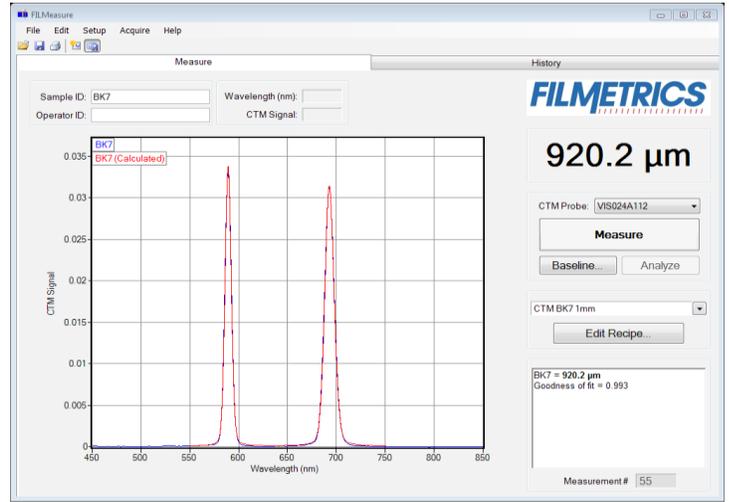
免费现场演示/支持

点几下鼠标就可以在网络上在线看到现场演示！请联系我们，我们的应用工程师会在电脑上为您演示薄膜测量是多么容易！



F70

薄膜厚度测量仪



F70 搭配不同的透镜可以测量不同厚度范围。

系统可升级增加全光谱反射能力：

镜头组件或升级套件	测量厚度范围 (指数=1.5)	稳定性 ¹	精度 ²	工作距离	斑点尺寸
LACTM-VIS-0.1mm	15 μm-0.15 mm	0.4 μm	0.05 μm	3.3 mm	10 μm
LACTM-VIS-0.3mm	30 μm-0.45 mm	0.7 μm	0.10 μm	4.5 mm	10 μm
LACTM-VIS-1mm	50 μm-1.5 mm	1.5 μm	0.20 μm	4.7 mm	10 μm
LACTM-VIS-2.4mm	150 μm-3.5 mm	2 μm	0.20 μm	13 mm	20 μm
LACTM-VIS-9mm	0.5 mm-15 mm	7 μm	2 μm	21 mm	50 μm
UPG-F70-SR-KIT	0.015 μm -40 μm	2 nm	0.1 nm	0-500 mm	1.5 mm ³

光谱仪

波长范围: 380 – 1050 nm

操作系统

PC: Windows XP(SP2) - Windows 8(64-bit)

Mac: OS X Lion/Mountain Lion running Parallels

基本要求

样品尺寸: 直径从 1 毫米到 300 毫米

光源: 钨卤素灯 (可选 LED)

接口: USB 2.0

电源: 100-240 VAC, 50-60 Hz, 20W

认证: CE EMC 和欧洲安全指令

¹ 取决于材料. 中等厚度的标准差

² 标准值, 在相同条件下, 一倍标准差的重复测量

³ 使用光纤配件 FO-SPL-PEG-SMA-100-1.3 时是 200μm



优尼康科技有限公司

– Filmetrics 薄膜厚度测量系统专业代理商

联系方式: 李先生 15900490105

盘先生 15989637322

Email: Info@unicorn-tech.com

Web: www.unicorn-tech.com

内容如有更改, 恕不另行通知 ©2014 Filmetrics, Inc

